

Армамид ПА6 СВ 40-1С

40-% стеклонаполненный светостабилизированный полиамид 6. Серийно выпускается в черном цвете.

Свойства	Стандарт испытаний	Единица измерения	Типичные значения
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ			
Плотность	ГОСТ 15139	кг/м ³	1450
Прочность при растяжении	ГОСТ 11262	МПа	185
Относительное удлинение при разрыве	ГОСТ 11262	%	5
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке	ГОСТ 4648	МПа	265
Модуль упругости при изгибе	ГОСТ 9550	МПа	10500
Ударная вязкость по Шарпи без надреза при +23°C	ГОСТ 4647	кДж/м ²	75
Ударная вязкость по Шарпи без надреза при -40°C	ГОСТ 4647	кДж/м ²	50
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ			
Температура плавления	ГОСТ 21553	°C	218
Температура изгиба под нагрузкой 1,8 МПа	ГОСТ 12021	°C	205
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ			
Показатель текучести расплава (250 °C; 2,16 кг)	ГОСТ 11645	г/10 мин	9
Усадка при литье, продольная	ГОСТ 18616	%	0,1-0,2
Усадка при литье, поперечная	ГОСТ 18616	%	0,6-0,8
Температура расплава		°C	260
Температура формы		°C	80
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ			
Электрическая прочность	ГОСТ 6433.3	кВ/мм	23
Удельное объемное электрическое сопротивление	ГОСТ 6433.2	Ом*м	1Е13
СТОЙКОСТЬ К ГОРЕНИЮ			
Максимальная температура стойкости к воспламенению при воздействии нагретой проволоки	ГОСТ 27483	°C	650

Примечание:

Технологические параметры литья и тип образца для измерения усадки необходимо уточнить у производителя материала.
При проектировании литьевых форм следует учитывать, что величина усадки зависит от параметров литья, формы и размеров изделия, а также от расположения, конструктивных особенностей и размеров литниковых каналов.

Редакция от 20.04.2017

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, носит среднестатистический характер. Она может являться основой для определения возможности использования материалов для конкретных областей применения. Поскольку не представляется возможным предусмотреть все варианты применения и условия эксплуатации материалов, НПП ПОЛИПЛАСТИК не дает гарантий и не берет на себя ответственности за использование сведений, указанных в каталоге. Данная информация может быть изменена по мере накопления новых данных.